Search Notes



Application/Control No.
10/780,939
Examiner
James D. Ewart

Applicant(s)/Patent under Reexamination

LEE, CHANG-KYU

Art Unit

2683

SEARCHED									
Class	Subclass	Date	Examiner						
455	9	3/10/2006	JDE						
	13.3								
	26.1								
	63.4								
-	67.11								
	68								
	82								
	115.1								
	115.4								
	121								
	123								
	129								
	193.1								
	226.1								

INI	INTERFERENCE SEARCHED										
Class	Subclass	Date	Examiner								
	<u>I</u>										

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)									
	EXMR								
•									
		-							

Search Notes (continued)

٦.		î	_	•			•						_			•			_				_		٠.	Ξ.	_	,
1	I	I	П	II	11	11	Ш	П	Ш	I	П	1	11	П	11	II	Ш	П	H	П	П	III	ı	П	ł		11	
ı	П	П	Ш	II	ľ	ı	Ш	Н	Ш	П	Ш	ı	Ш	Ш	H	П	Ш	Ш	H	П	Н	Ш	ı	Ш	П	Ш	11	
ı	П	ı	Ш	I	li	П	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	П	IJ	Ш	H	u	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	П	Ш	Н	Ш	1	
ı	П	ı	Ш	II	II	H	Ш	Ш	Ш	Ш	H	Ш	Н	Ш	Ш	l	Ш	Ш	Ш	Ш	Н	Ш	П	Ш	Ш	Н	Ш	
1	П	П	Ш	Н	II	И	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	ı	Ш	П	Н	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	П	Ш	П	Ш	Ш	
1	Ш	П	Ш	П	II	Ľ	Ш	H	Ш	ш	и	ш	Н	Ш	П	Ш	ш	п	Ш	Ħ	н	Ш		Ш	н	ш	Ш	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/780,939	LEE, CHANG-KYU	
Examiner	Art Unit	
James D. Ewart	2683	

	SEARCHED									
Class	Subclass	Date	Examiner							
455	423	3/10/2006	JDE							
	562.1		-							
	550.1									
	575.7									
343	703									
	711									
	751									
	893									
	894									
	876									
342	173									
	423									
	444									

INT	INTERFERENCE SEARCHED											
Class	Subclass	Date	Examiner									
			_									
		· - · ·										
	1											
		į										

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)									
	DATE	EXMR							
	:								